

## 1. STEM

廠商 Manufacturer : JEOL

型號 Model : JSM-F200

規格 Specification : FETEM Schottky Cold FEG



- (1) 全新智慧設計:洗鍊的外觀、卓越的機械與電子穩定度搭配專門為分析式電子顯微鏡設計的全新操作介面
- (2) 四級聚光電磁透鏡(Condenser lens): 電子束光斑強度與收斂角獨立調整
- (3) 高階掃描系統:提供 STEM-EELS 更寬廣的掃描範圍
- (4) Pico 驅動載台: 全新皮米(10-12m)精度載台，可在沒有 Piezo 驅動情況下移動全樣品至原子尺度的動態範圍
- (5) Specporter (自動樣品桿進出系統):不僅減少樣品桿進出可能的人為疏失，對盛載液態氮的實驗，不須傾轉樣品桿，方便且節省液態氮損失
- (6) 改良式冷場發射電子槍:除了標準的熱場發射電子槍外，也可以選購高能量解析的冷場發射電子槍，由於降低了色散像差，影像解析度提高並增強 EELS 化學鍵結分析能力
- (7) 可搭載雙 SDD EDS:新型 EDS port 設計可搭載兩支大面積高感度 SDD EDS, 超大立體接收角在容易受電子束損傷樣品分析上尤其方便
- (8) 節能模式:創新的 ECO 節能模式在儀器不使用的情况下其耗能僅相當於正常模式的 1/5，並可設定回復正常模式的時間點，節能並善待環境